

# 理学部講演会

## 講演タイトル

走査型電子顕微鏡で見る絶縁物  
～ソフトマテリアル・金属酸化物～

## 講演者

作田 祐介 氏

(日本電子株式会社 SM事業ユニット SMアプリグループ)

## 概要

走査型電子顕微鏡 (SEM) は合成した試料表面の形態観察や分析が出来るため、基礎研究から製品の信頼性解析まで幅広い分野で使用されている。一方、SEMは電子線により像を形成するため絶縁物観察に不向きとされている。しかし、最近の技術発展から絶縁物材料 (例えばポリマーや金属酸化物) も観察や分析が可能になってきた。

本講演ではそのSEM技術や応用、試料作製方法などを紹介する。

## 日時

12/10(Wed) 16:30-17:30

理学部1号館14番教室

## 担当

富樫 (内4516)

togashi@sci.kj.yamagata-u.ac.jp